

卓上顕微鏡
TM3030Plus

HITACHI
Inspire the Next

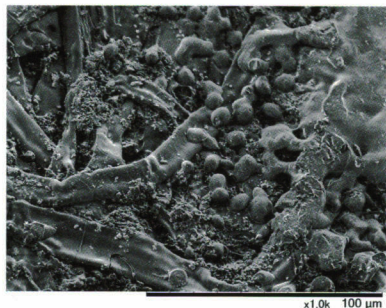
Miniscope® TM3030Plus



広がる低真空観察の世界

TM3030Plusは、低真空雰囲気で二次電子像観察が行えます。

Plus 1 高感度低真空二次電子検出器を搭載



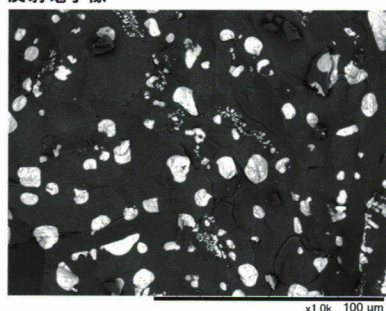
TM3030Plusは、上位機種で採用している高感度低真空二次電子検出器を搭載しました。試料前処理を行うことなく低真空雰囲気下で二次電子像を観察できます。

試料:印字した紙(導電処理なし)
 二次電子、表面(5 kV)、帯電軽減モード、倍率:1,000 倍

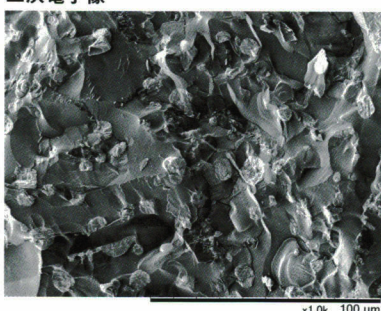
Plus 2 試料の微細形状と組成情報を合成して表示可能

TM3030Plusでは、同一視野の二次電子像と反射電子像を合成して表示できるため、試料表面の微細形状と組成情報を同時に観察できます。

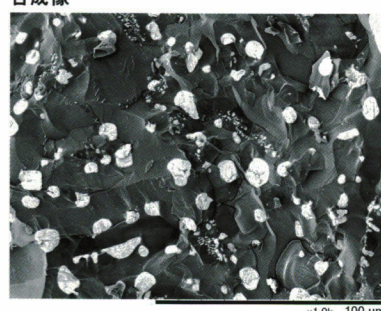
反射電子像



二次電子像



合成像



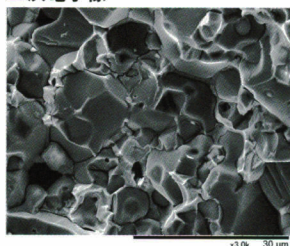
試料:セラミックス(導電処理なし)
 表面(5 kV)、標準モード、倍率: 1,000 倍

Plus 3 大口径(30 mm²)SDDを搭載したEDX[®]による迅速分析

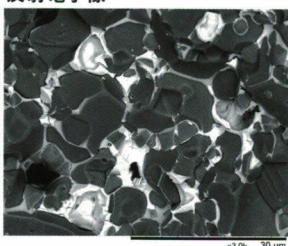
EDX(エネルギー分散型X線分析装置)には、30 mm²の大口径SDD(シリコンドリフト検出器)を搭載し、効率よく迅速に定性分析、元素マッピングが行えます。

金属コーティングなどの前処理を省き、貴重な試料もダメージを抑えながら、観察から分析までシームレスに行えます。

二次電子像

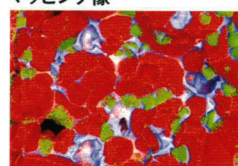


反射電子像

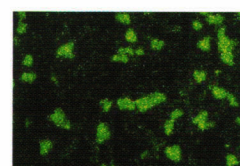


試料:ポリスタ破面(導電処理なし)
 通常(15 kV)、標準モード、倍率:3,000 倍

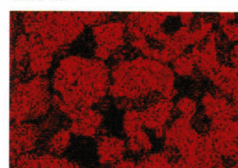
マッピング像



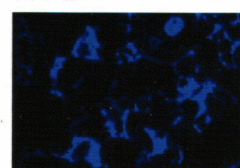
合成マップ



アンチモン



亜鉛



ビスマス

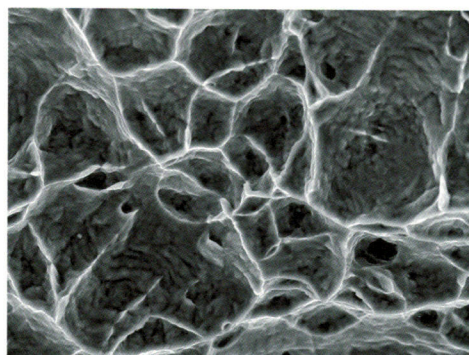
※オプション

アプリケーション ギャラリー



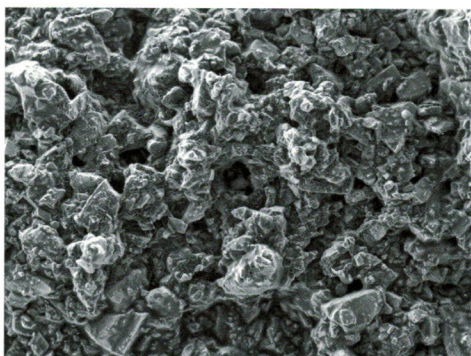
x30k 3.0 μm

試料:太陽電池銀配線 (導電処理なし)
二次電子、通常(15 kV)、標準モード、倍率: 30,000 倍



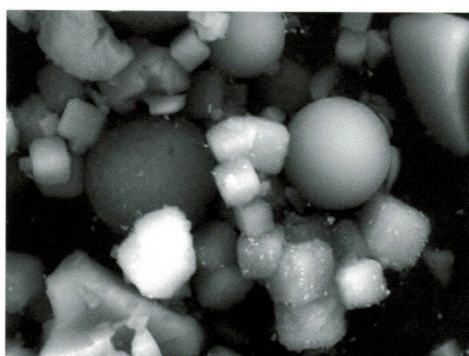
x5.0k 20 μm

試料:金属破面 (導電処理なし)
二次電子、通常(15 kV)、標準モード、倍率: 5,000 倍



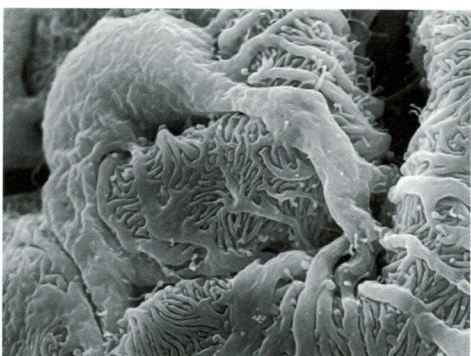
x600 100 μm

試料:歯磨き粉 (導電処理なし)
二次電子、表面(5 kV)、標準モード、倍率: 600 倍



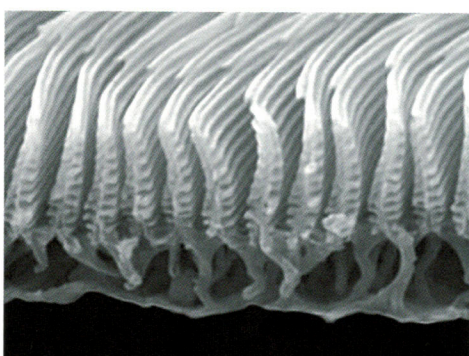
x10k 10 μm

試料:パウダースプレー (導電処理なし)
二次電子、通常(15 kV)、帯電軽減モード、倍率: 10,000 倍



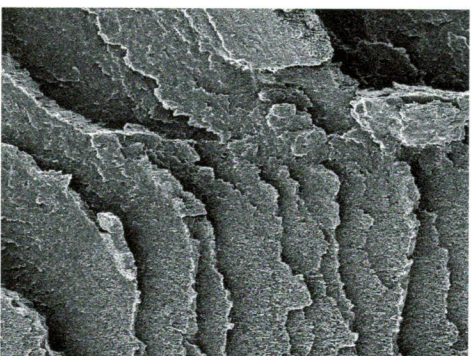
x10k 10 μm

試料:腎臓系球体 (導電処理あり)
二次電子、通常(15 kV)、標準モード、倍率: 10,000 倍



x20k 3.0 μm

試料:蝶の羽 (導電処理あり)
二次電子、通常(15 kV)、標準モード、倍率: 20,000 倍



x1.0k 100 μm

試料:樹脂材 (導電処理あり)
二次電子、表面(5 kV)、標準モード、倍率: 1,000 倍



x1.0k 100 μm

試料:胃薬 (導電処理なし)
合成、表面(5 kV)、標準モード、倍率: 1,000 倍

